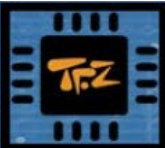


# 科技部計畫

針對內建人工智慧之車用晶片且以  
【零故障】為目標之智慧型測試方法(TfZ)  
會議記錄

---

2020/04/21



# 會議資訊

- 時間 – 2020/04/21 15:30 ~
- 地點 – Skype線上會議(清華大學 台達館 923)
- 與會成員 – 清華大學
  - 黃錫瑜 教授
  - 許竹均 DRI / 會議記錄
  - 蔡承霖 Workshop 聯繫人
  - 楊竣宇 Website聯繫人
  - 楊舜華 碩士生
  - 林昂德 碩士生
  - 劉霖 碩士生
- 交通大學
  - 溫宏斌 教授
  - 林禹文 DRI
  - 梁家為 博士生
  - 湯忠禮 碩士生
- 中山大學
  - 李淑敏 教授
  - 李建德 DRI
- 彰師大
  - 黃宗柱 教授
  - 黃靖 DRI

# 議程

- 一般行政事項討論
  - 計畫網頁說明
  - workshop 籌備事宜
- Tfz計畫討論
  - 小組技術分享(中山/中興大學)
  - 未來成果展示之規劃
- 臨時動議與下次月會時間討論

# 一般行政事項討論-計畫網頁說明

■ 聯繫人      清大 楊竣宇 碩士生

■ 新增計畫網頁時間軸

# 一般行政事項討論-Workshop籌備事宜

- 聯繫人      清大 蔡承霖 碩士生
  - 因應疫情，暫緩實體workshop的舉辦，暫時設定為線上模式
  - 若疫情許可，暫定7~9月期間舉行第一次workshop
  - 地點暫定日月潭教師會館

# Tfz計畫討論-技術分享與討論(中山/中興大學)

- 主題:

**TestDNA: Novel Wafer Defect Signature for Diagnosis and Yield Learning**

- 講者 中山/中興大學 李建德

- (內容請參閱上傳至網頁的附件)

# 下次月會綱要

- 舉行時間                                    2020/05/19      15:30開始
- 舉行方式                                    Skype線上會議
- 會議通知與議程                            清大 許竹均 將會事先發送給參與人員
- 技術分享主持                                清華大學
- 技術分享學校                                交通大學
- 報告投影片將事先放在資料庫中分享(清大 許竹均 負責)



**Thank You for Your Participation**